3. 試作・少量用プリント回路基板の作成技術に関する研究

電子部 佐 藤 哲 哉

エレクトロニクスの進展に伴い、プリント回路基板の製作期間短縮、試作の効率化等のために少量のプリント回路 基板を簡易に作成する装置への関心が高まっている。しかし、近年の回路パターンは、益々徴細化傾向にあり、従来 の回路パターンを直接機械加工する方式では対応できなくなってきている。このため、徴細加工が可能な高出力レー ザによるプリント回路パターンの形成に関する研究を行った。この結果、銅箔厚が18 μmであれば、本システムで の微細パターン加工が可能である。しかし、レーザのプリント基板の絶縁基材であるガラスエポキシに対する加工性 の問題によりスルホール用の貫通穴の加工はできない。絶縁材の材質、レーザ光の波長の検討等が必要である。

1.緒言

要旨

各種 I C、L S I 等を中心とする電子部品の進展に伴 い、自動化、省力化機器の機能・性能は日々高度化し、 かつ、軽薄、短小化してきている。これを支えている基 本的要素の一つが、電子部品の配置、各部品間の配線を 効率的に実現しているプリント基板である。

現在、プリント基板も多層化の傾向にあり4層プリン ト基板は、常識化しており6層等多層化の傾向が益々顕 著になってきている。これら多層化基板は、表裏2面を 除いてはプリントパターンの修正は困難である。このた め、電子回路設計に基づく機能・性能確認のための試作 段階においては、その使用に難があり、試作効率が低下 する。

本来、専門メーカに依頼するプリント基板は、同じも のを多量につくる場合等に適しており、試作段階のよう に、最低1枚あれば充分であり、かつ、状況によっては、 配線の削除、追加等の変更が発生するような場合、ある いは、少量生産の場合には、経費、時間のロスが大きい。

また、現状のプリント配線の導体幅、導体間隔は、 0.1~0.2mm、ランド径は、1mm以下とパター ンの微細化が進んでいる。これら微細化されたパターン を自作する場合、従来のエッチング技術またはミーリン グカッターによる機械的なパターン形成手法では、設備、 ノウハウ、精度等の面で多くの問題がある。

このような状況を踏まえ、レーザを利用した試作・少 量用プリント基板の作成技術に関する研究を実施する。

2. 実験方法

実験構成図を図1. に示す。レーザからのビーム光は、

反射ミラーにより顕微鏡側面部に入射し、更に、顕微鏡 内の干渉フィルターにてレーザ光のみが反射して対物レ ンズにより試料(プリント基板の原板)に集光・照射さ れる。試料台は、XYZステージにより構成され、レー ザ光のON/OFFを行うメカニカルシャッターと共に、 パソコン(PC98NOTE)のGPIBにより制御さ れる。また、加工による飛散物が対物レンズに付着する のを防ぐため、ノズルよりAirを試料に流す。加工状 態はCCDカメラにより撮影し、モニターにて観察する。

なお、使用したレーザは、YAGレーザの第2高調波 (波長:532nm)、繰り返し周波数:50Hz、パ ルス幅:6nsec、出力ネルギー:max90mJ (Spectra-Physics社GCR-150)である。

ここで、対物レンズは、超長作動距離対物レンズ
 (CFMPlan ELWD40×:ニコン製)で作動
 距離が10mm、焦点距離が5.1mmのものを使用している。



図1 実験構成図

このような一般の対物レンズを使用しているため、レー ザのピークパワーが大きいとレンズ張り合わせ部等にて 場合によってはレンズの割れ等が発生する恐れがある。 本システムでは、ピークパワー:1MW程度が使用限界 である。

— 36 —

尚、本システムでは、対物レンズで集光されたレーザ 光の焦点位置と接眼レンズで見る焦点位置とは若干異な る。以後、集光されたレーザ光が試料表面に照射される 位置を照射位置と称し、接眼レンスで見るベストフォー カス位置(目視)を基準としてZ方向(+, -)で表記 する。

レーザ光を対物レンズで集光する場合、レーザのピー クパワーによっては、その焦点位置空間において、プラ ズマの発生が見られる。プラズマの発生は、エネルギー の損失を伴うため、加工性の向上に寄与しないと言われ ている。

実験で使用する銅張積層基板は、信頼性に優れ、広く 産業用に普及しているガラス・エポキシ銅張積層基板 (銅箔の厚さ:18μm及び35μm)とする。

ここでは、利晶工業(株)製のCS-3230(銅箔の
 厚さ:18μm及び35μm)である。

3. 実験結果及び考察

1. レーザによる銅張積層基板の銅箔面加工特性
 1. 1. 穴加工特性

穴加工特性は、銅張積層基板の銅箔面加工において、 線及び面(パターン)を加工する際のレーザパワーの (平均値)適性値、加工に要する時間、集光されたレー ザ光の照射位置の制約等の条件の基準となるものである。 (1)穴加工に必要なレーザショット数

表1に18 μ m銅箔厚に対するレーザ光照射位置、レー ザパワー、銅箔の貫通穴加工が可能なレーザパルス数の 関係を示す。また、表2に35 μ m銅箔厚に対する同関 係を示す。ここで、レーザ光照射位置は、CCDカメラ

	0.25 W	0.2 W	0.16 W	0.08 W
65µm	2	3	3	×
75	2	2	2	3
8 5	2	2	2	2
95	1	1	1	1
105	1	1	1	1
1 1 5	1	1	1	1
125	2	2	2	2
135	3	3	3	3
145	×	×	×	×

表1 18 µm銅箔貫通レーザShot数 (ここで、×は4 Shot以上を要する。)

	0.25 W	0.2 W	0.16 W	0.08 W
65 µ m	×	×	×	×
75	×	×	×	×
85	×	×	×	×
95	3	3	3	3
105	2	2	2	2
115	2	2	2	2
125	2	2	2	2
135	4	4	4	4
145	×	x	x	x

表 2 35 µm銅箔貫通レーザShot数 (ここで、×は 5 Shot以上を要する。)

によるモニタ上での観測されるベストフォーカス位置を 基準としてプラスZ方向の値である。

表2より、照射位置105 μ m±10 μ m内で18 μ m 銅箔厚の1Shot加工が可能であることが解る。一方、 表3より、35 μ m銅箔厚の1Shot加工は困難であ り、少なくとも2Shot以上が必要である。この時の 最適な照射位置は、115 μ m±10 μ mであり表2に 比べ、10 μ m程Zプラス方向に移動している。これは、 1Shot目で少なくとも18 μ mの深さ加工が可能 (表1より)であるため、その分2Shot目で等価的 に照射位置が最適化したものであると考えられる。

(2)加工穴形状

写真1及び2にレーザパワー0.25W時の各々レー ザ光の最適照射位置における左から1~3Shot照射 時の表面形状SEM写真を示す。ピークパワーが大きい ため、周辺部に盛り上がりが見られる。Shot数は、 穴形状には顕著に関係せず深さ方向への影響に関係して いることが解る。また、レーザパワーの相違による穴形 状の顕著な差異は認められなかった。

写真1及び2に各々1Shot照射時の拡大SEM写 真を示す。レーザ波長:532nmは、基本波:1064 nmに比べて、熱的影響が少ないと考えられるが、加工 部周辺部には、熱的影響部が観察される。18 μ m銅箔 厚の場合、基材(ガラスエポキシ部)への影響も小さく 比較的良い銅箔の貫通穴加工がなされていることが解る。 一方、35 μ m銅箔厚の場合、貫通穴は形成されていず、 更に大きなエネルギーが必要である。しかし、本レーザ では、パワーを増加するとフォーカス近傍でプラズマの 発生が顕著となり、実際の加工特性の向上には寄与しな

— 37 —

い。このため、1 S h o t で貫通するためには、プラズ マの発生を抑制するようレーザパルス幅が長く、ピーク パワーが比較的大きなレーザシステムを使用する必要が ある。



写真1 18 µ m銅箔厚



写真 2 35 μ m銅箔厚 (3)加工貫通穴径と表面穴径

ここで、貫通穴径は、銅箔部を貫通した穴径を、また、 表面穴径は、盛り上がりを含めた表面部の穴径を表す。 (図2参照)図3及び図4に各々1Shot、2Shot 照射時の銅箔貫通穴径と表面穴径を示す。0.16W以 上で、レーザパワー、照射位置による加工貫通穴径、表 面穴径の顕著な変化は見られないが、18 μ m銅箔の場 合、照射位置105 μ mを中心として、+10 μ mでは 加工貫通穴径、表面穴径共寸法的に10 μ m程度の減少 が見られる。これは、105 μ mが正に銅箔表面でレー ザ光のピントが合った状態であり、115 μ mでは表面 上部にピントがあり、プラズマの発生によるエネルギー の損失に起因しているものと考えられる。一方、95 μ m



図2 加工貫通穴径と表面穴径



では、ピントが銅箔内部にあるため、プラズマの発生が 薄い銅箔をまきこんで加工性に若干の寄与をしているも のと考えられる。

また、35μm銅箔の場合、銅箔が厚いため1Shot 目と2Shot目の照射時のレーザ光のピント位置がど こにあるかによって、加工特性が18μm銅箔の場合と 若干異なっているものと考えられる。

これら関係から、 18μ m銅箔厚の場合、最小でも加 工貫通穴径=約 20μ m、表面穴径=約 50μ mが確保 される。また、 35μ m銅箔厚の場合、2Shot必要 であるが同様に各々約 30μ m、約 40μ mが確保され ると言える。



しかし、この内の35 μ m銅箔厚の場合には、銅箔の 貫通穴加工に2Shot必要であり、本レーザシステム の使用を前提とするならば、レーザのShotの繰り返 し周波数が50Hzであるため、多大の加工時間を要し、 実用上問題がある。

以下、実用性を重視する意味で18µm銅箔厚に対す る検討に限定する。

3.1.2 線加工特性

(1) 加工スピードによる加工特性

定速での線加工は、基本的には3.1.1項の穴あけ 加工の延長である。使用するレーザ光は、50Hzのパ ルス光であるため、加工スピードによる制約を大きく受 ける。18 μ m銅箔厚の場合、1Shotで貫通する穴 径は、照射位置=105 μ m±10 μ mの時、約20 μ m ~40 μ mである。このため、少なくとも、Shot間 の距離は、20 μ m即ち、1mm/sec以下の加工ス ピードが必要となる。(1mm/sec÷50Hz= 20 μ m)

また、一方、穴あけ加工時に観測されたもう一 つの 表面穴がこのようなShot穴あけ加工の連続として考 えられる線加工にどのように影響を及ぼすかが課題とな る。貫通穴は、直接加工に反映するが、表面穴は周辺部 を含めてその内部構造への影響が考えられ、近接する Shot加工時の相乗的影響を検討する必要がある。図 5~図7に、1mm/sec~3mm/secの加工ス ピードの時の線加工状態の模式図と写真を示す。(但し、 レーザ照射位置=105 μ mである。)線加工としては、 1mm/secが適当である。模式図に示すように隣接・ 交差する表面穴の領域が相乗効果により、加工に寄与し ている。2mm/sec~3mm/secの場合、連続 的な線加工は困難である。



図 5 線加工(1mm/sec)



図7 線加工(3mm/sec)

(2) レーザパワー、照射位置による加工特性 表3に、加工スピード1mm/secの時のレーザパワー、フォーカス位置による線加工状態を示す。3.1. 1項の表2と比較して、照射位置=105µmを基準と 考えると、その(一)方向の照射位置=85µmでは、 1Shotでは銅箔の貫通はないが、線加工では隣接 Shotによる影響で連続加工が可能となっている。一 方、同様(+)方向の照射位置=125µmでは、隣接 Shotによる加工性の向上が見られない。

この結果からも、集光されたレーザ光の焦点が銅箔の 内部にある時は、加工性(主に深さ方向)に寄与してい ることが解る。

以上により、レーザパワー=0.16W以上ならば、 照射位置=100 μ m±15 μ mで連続な線加工が可能 であることが解る。

— 39 —

平成5年度 研究報告 大分県工業試験場

		レーザパワー					
		0.25 W	0.2 W	0.16 W	0.08 W		
	75 µ m	Á	×	×	×		
V	85	0	0	0	×		
 +#	95	0	0	0	\triangle		
照	105	0	0	\sim	0		
射 位	115	0	0	\triangle	\triangle		
置	125	Δ	×	×	×		
	135	×	×	×	×		

表3 18μm銅箔の線加工
 (〇:貫通加工、△:一部未穴、×:未穴)
 (3)加工断面形状

断面形状図を図8に示す。



図8 断面形状図

①加工角

レーザ光は、試料にある集光角をもって照射されるた め、銅箔面を垂直状に加工することができず、テーパ状 加工となる。レーザ光が一種の衝撃エネルギーであるた め、その集光角(±23.3度)との対応は困難である が、レーザ照射位置=105µmを中心として、加工角 が除々に大きくなっている。この関係を図9に示す。



②表面穴径と貫通穴径

3.1.1項で検討した表面穴径と貫通穴径に相当す る径との比較関係を図10に示す。隣接Shotによる 相乗効果は、貫通穴径の加工性(深さ方向の加工への寄 与)に寄与している。



③その他

また、全体的に加工周辺部の4~5 μ m程度の盛り上がり、基材への加工深さ10 μ m程度が見られる。

3. 1. 3. 面加工特性

(1)加工条件

レーザでの加工の場合、広い範囲の面を一度に加工す ることはできない。一次元加工である線加工を図11に 示すように2次元に連続的に拡張していく他ない。線加 工の場合、表面穴の相乗効果が一方向みであったが、面 加工の場合は加工間隔によっては、多方向からの一層の 相乗加工効果が期待される。一方、加工間隔を狭めるこ とは、加工時間の増大を招く。



<i>ν</i> -	- ザパワー	0.25 W		0.16 W			0.08 W			
V(n	nm/sec)	1	2	3	1	2	3	1	2	3
加	30 µ m	0	0	\triangle	0	0	\triangle	0	\bigtriangleup	×
I	40 µ m	0	0	×	0	0	×	\triangle	×	×
間	50 µ m	0	\triangle	×	0	×	×	×	×	×
隔	60 µ m	\triangle	×	×	0	×	×	×	×	×

表 4 加工間隔による面加工特性 (〇:加工良、△:一部付着(除去可能)、×:未加工)

これら問題を検討するため、レーザパワー、加工速度、 加工間隔をパラメータとして、照射位置=105 μ mの ときの3mm×3mmの面加工を実施した。表4に加工 特性、図12にその加工に要する時間の関係図を示す。

表4 での○印は、銅箔が完全に除去された状態であり、 △印は、銅箔と基材との剝離が完全ではなくその銅箔の 一部が基材に付着している状態である。しかし、これは 容易に除去可能である。





レーザパワーが0.16W以上では、加工速度=1~ 2mm/sec、加工間隔=30~40 μ mの間で良好 な加工が得られている。加工時間は、加工速度=2mm/ sec・加工間隔=40 μ mの時、最短である。

面加工の場合、相乗効果を含めた直接的な加工のみな らず、その加工間隔によっては銅箔と基材(ガラスエポ キシ部)との接着部を剝離することによって、間接的に 加工に寄与すると考えられる。

このことにより、3. 1. 2項の線加工では、加工速度 = 2 mm/s e c の時は加工が困難であったが、面加工 ではそれが可能となっている。図13~15に、表4で のレーザパワー=0. 25W時の加工間隔60 μ mでの 加工状態を模式図と写真で示す。





図13 面加工状態(加工速度=1mm/sec)



図14 面加工状態(加工速度=2mm/sec)







(2) パターン加工

(1) 項の条件を加味し、パターン加工を実施した。

加工条件は下記の通り。

<加工条件>						
①レーザパワー	:	0.	2	5 W		
②レーザ照射位置	:	1 0	5	μm		
③加工速度	:	2 m 1	m,	/ s	е	с
④加工間隔	:	4 0	μ	m		

加工された表面のSEM写真を写真3~4に示す。加 工目標に沿う良好な加工がなされている。ただし、写真 上、明確ではないが加工端では線加工と同様に4~ 5µm程度の盛り上がりがある。



写真3 パターン加工例



写真4 パターン加工例(拡大)

3.1.4. レーザによる基材の穴あけ加工

レーザによるガラスエポキシ基板への高精度な穴あけ 加工が可能であれば、従来のドリル加工で生じる粉塵の 解消、銅張積層基板を移動することなしに、同一設置面 でパターン加工と穴あけ加工が容易に実現できる。

このため、基板の加工性を検討した。サンプルは、 1.6mm厚のガラスエポキシ基板(CS3 230) <利晶(株)製>である。

図16に、1mm×1mmの穴加工時の各々の深さ方 向の特性図を示す。ここで、レーザは、1mm平方の周 囲を1回走査し、次に図中Z方向送りに相当する分Zス テージを移動する。この繰り返し回数と加工深さとZ方 向送りイテップとの関係を示している。この時、レーザ ザパワー=0.25W、レーザ走査加工速度=1mm/ sec、加工スタートレーザ照射位置=105μmであ る。図17にこれら加工に要する時間を示す。Z方向: 30μmステップでの加工性が良い。しかし、1.6mm 厚の穴加工は困難である。

写真5に、基材の穴加工断面図を示す。基材内部のガ ラス繊維による反射、散乱の影響で加工路が歪曲してい る。また、加工表面も鋭角的な加工性を有しておらず精 度面からも問題がある。加工面仕上がり状況では、レー ザが同一線上を幾度も走査されるため、基材に対する熱 的影響が加工周辺部に観測され、ドリルによる加工面に 比し著しく劣る。



これらより、基材に対する加工性には問題があると言 える。高精度穴あけ加工には適さない。レーザ波長が更 に短い、355nmまたは、266nm(YAGレーザ 高調波)での検討が必要であろう。この際、紫外光であ

- 42 -

るため、本システムの可視光学系では役を成さない。紫 外光用光学系を構成する必要がある。



写真5 ガラスエポキシ穴加工断面図 (30 µ m ステップ、30回)

3.1.5.結論

(1) パターン形成

銅張積層基板の銅箔加工によるパターン形成について、 下記条件で現状での微細パターンとされている導体幅、 導体間:0.1~0.2mmの加工が可能である。

①銅箔の厚さ	:	18	μm
②レーザパワー	:	0.	16W以上
③レーザ照射位置	•	1 0	$0 \ \mu \mathrm{m} \pm 1 \ 5 \ \mu \mathrm{m}$
④加工速度	•	$1 \sim$	2mm⁄sec
⑤加工間隔	:	3 0 -	\sim 40 μ m

(2) 高精度穴加工

本システムのレーザ波長(532nm)での加工性に は問題がある。パターン形成と同時に非接触で穴加工を 実現することは困難である。このため、現状では、レー ザによるパターン形成とドリルによる穴加工を併用する ことが妥当である。

3.1.6.今後の課題

(1)広範囲なパターン加工をする際、銅張積層基板の
 平行度を±15μm以内に保持する必要がある。

(2)加工端部の盛り上がりが電気的特性に与える影響 についての検討

(3) 導体幅が狭い場合のレーザが銅箔と基材の密着性 に与える影響についての検討(銅箔の剝離強度)

 (4) レーザ波長による比較検討(1064nm、 355nm、266nm)ーパターン形成、基材の穴あ
 けー

(5) レーザ波長による加工性の良い基材の材料検討

(6)加工時間の短縮化

(7)本システムでは、レーザのON/OFFはメカニ カルシャッターを使用している。このため、動作遅れに よる加工過多が生じる。レーザのON/OFFは電子制 御で行うことが望まれる。

参考文献

- ・平成6年レーザ学会第14回年次大会予稿集
 21aN7及び21aN8
- レーザ学会研究報告 RTM-93-33
- レーザハンドブック(朝倉書店)